

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 08134388

PUBLICATION DATE

: 28-05-96

APPLICATION DATE

: 14-11-94

APPLICATION NUMBER

: 06279427

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR: NAKAMURA YOSHIFUMI;

INT.CL.

: C09D 11/00 H05K 1/09

TITLE

: ELECTRICALLY CONDUCTIVE INK

ABSTRACT: PURPOSE: To obtain an electrically conductive ink running to a highly reliable electrode in

good state even if used on a high-accuracy glass-ceramic multilayer substrate

nonshrinkable in the planar direction.

CONSTITUTION: This electrically conductive ink at least contains a solvent, organic binder, and a mixture comprising 80.0-95.0vol.% of CuO 1.0-7.0µm in average particle diameter, 1.0-10.0vol.% of at least one kind of metallic powder selected from Ni, Mo, Zr and Mn 1.0-6.0µm in average particle diameter and 4.0-10.0vol.% of an inorganic binder 1.0-5.0µm in average particle diameter, with the inorganic ingredient dispersed in the final

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平8-134388

(43)公開日 平成8年(1996)5月28日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 9 D 11/00 H 0 5 K 1/09 PSV

A 7726-4E

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出願番号	特願平6-279427	(71)出願人 000005821
		松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)11月14日	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 三浦 和裕
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 別所 芳宏
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 祐伯 聖
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 池内 寛幸 (外1名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 導電性インキ

(57)【要約】

【目的】 平面方向に収縮を起こさない高精度のガラス ・セラミック多層基板に使用しても信頼性の高い良好な 状態の電極となる導電性インキを得る。

【構成】 平均粒径1.0~7.0μmのCuOが8 0.0~95.0体積%、Ni、Mo、Zr及びMnの うち少なくとも1種である平均粒径1.0~6.0μm の金属粒子が1.0~10.0体積%、平均粒径1.0 ~5. 0 μm無機パインダが4. 0~10. 0体積%か らなる混合物と、溶剤と有機パインダとを少なくとも含 み、無機成分を分散させた導電性インキ。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 無機成分、溶剤及び有機パインダを少な くとも含む導電性インキであって、CuOが80.0~ 95. 0体積%、Ni、Mo、Zr及びMnから選ばれ る少なくとも1種である金属粒子が1.0~10.0体 積%、無機パインダが4.0~10.0体積%からなる 無機組成物を含み、無機成分を分散させたことを特徴と する導電性インキ。

【請求項2】 CuOの平均粒径が1.0~7.0μm である請求項1に記載の導電性インキ。

【請求項3】 金属粒子の平均粒径が1.0~6.0μ mである請求項1に記載の導電性インキ。

【請求項4】 無機バインダの平均粒径が1.0~5. 0μmである請求項1に記載の導電性インキ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体LSI、チップ部 品などを搭載し、かつそれらを相互配線する為のセラミ ック多層基板の内外部の電極パターンに適用するための 導電性インキに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体LSI、チップ部品等は小 型・軽量化が進んでおり、これらを実装する配線基板も 小型・軽量化が望まれている。このような要求に対し て、セラミック多層基板は、高密度配線が得られ、かつ 薄膜化が可能なことから、今日のエレクトロニクス業界 において重要視されている。

【0003】このセラミック多層基板に使用される電極 材料としての導体組成物は、一般に導電性金属、無機酸 化物、ガラス粉末が有機媒体中に分散されているペース 30 ト状組成物である。近年、低温焼結ガラス・セラミック 多層基板の開発によって、使用できる導体材料では、C uが比抵抗が小さく半田濡れ性も優れているため、Cu の電極材料の使用が望まれている。

【0004】低温焼結多層基板にCuを使用する方法と して、内層および最上層にCu電極を用いる方法があ る。導体抵抗、半田濡れ性、コストの点で最も良いが、 すべて窒素などの中性雰囲気で焼成しなければ成らずそ の作製が困難である。一般にCu電極を使用するには、 基板上にCuペーストをスクリーン印刷にて配線パター 40 ンを形成し、乾燥後、Cuの融点以下の温度(850~ 950℃程度)で、かつCuが酸化されず導体ペースト 中の有機成分が十分燃焼するように酸素分圧を制御した 窒素雰囲気中で焼成を行なうものである。多層する場合 は、同様の条件で絶縁層を印刷焼成して得られる。しか し、焼成工程における雰囲気を適度な酸素分圧下にコン トロールすることは困難であり、また多層化する場合、 各ペーストを印刷後その都度焼成を繰り返し行なう必要 があり、リードタイムが長くなり設備などのコストアッ プにつながるなどの課題を有している(特開昭57-50 50 成物を取り除くという技術が提案されている。これによ

3321号公報)。そこで特開平3-20914号公報 において、セラミック多層基板の作製にあたり、CuO ペーストを用い、脱パインダ工程、還元工程、焼成工程 の3段階とする方法が提案された。それはCuOを導体 の出発原料とし多層体を作製し、脱パインダ工程は、炭 素に対して充分な酸素雰囲気でかつ内部の有機パインダ を熱分解させるに充分な温度で熱処理を行い、次にCu OをCuに還元する還元工程、基板の焼結を行なう焼成 工程を備えた方法である。これにより、焼成時の雰囲気 10 制御が容易になり緻密な焼結体が得られるようになっ

【0005】一方、セラミック多層基板は焼成時に焼結 に伴う収縮が生じる。この焼結に伴う収縮は、使用する 基板材料、グリーンシート組成、粉体ロットなどにより 異なる。これにより多層基板の作製においていくつかの 問題が生じている。まず第1に、多層セラミック基板の 作製において前述のごとく内層配線の焼成を行なってか ら最上層配線の形成を行なう為、基板材料の収縮誤差が 大きいと、最上層配線パターンと寸法誤差の為内層電極 20 との接続が行えない。その結果、収縮誤差を予め許容す るように最上層電極部に必要以上の大きい面積のランド を形成しなければならず、高密度の配線を必要とする回 路には使用が難しい。その為収縮誤差にあわせて最上層 配線の為のスクリーン版をいくつか用意しておき、基板 の収縮率に応じて使用する方法が取られることもある。 この方法ではスクリーン版が数多く用意しなければなら ず不経済である。

【0006】また最上層配線を内層と同時に焼成を行な えば大きなランドを必要としないが、この同時焼成法に よっても基板そのものの収縮誤差はそのまま存在するの で、基板への部品搭載時のクリーム半田印刷において、 その誤差の為必要な部分に印刷できない場合が起こり、 また部品実装においても所定の部品位置とズレが生じ

【0007】これらの収縮誤差をなるべく少なくする為 には、製造工程において、基板材料およびグリーンシー ト組成の管理はもちろん、粉体ロットの違いや積層条件 (プレス圧力、温度)を十分管理する必要がある。しか し、一般に収縮率の誤差は±0.5%程度存在すると言 われている。

【0008】このことは多層基板にかかわらずセラミッ ク、およびガラス・セラミックの焼結を伴うものに共通 の課題である。そこで特開平5-102666号公報に おいて、低温焼結ガラス・セラミックよりなるグリーン シートに電極パターンを形成したものを所望枚数積層 し、この積層体の両面、もしくは片面に前記ガラス・セ ラミック低温焼結基板材料の焼成温度では焼結しない無 機組成物よりなるグリーンシートで挟み込む様に積層 し、前記積層体を焼成し、しかる後に焼結しない無機組

り基板材料の焼結が厚み方向だけ起こり、平面方向の収 縮がゼロの基板が作製できる。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従 来技術には幾つかの課題がある。それは例えば、焼成時 の基板収縮が厚み方向のみに起こるため、前述の様な従 来の電極用ペースト状組成物では焼成後の電極が粗な膜 構造になってしまうことである。配線電極構造が粗であ ると、基板との密着が弱くなり電極が基板から剥離を起 す、外気との接触面積が多いために電極の酸化がされや 10 すくなり信頼性が低くなる等の課題がある。また基板焼 結と電極の焼結のマッチングがとれていなければ、ガラ ス・セラミック多層基板焼成時に、基板焼結開始よりも 導体材料の焼結の方が早く開始するために基板が導体の 焼結を抑えることが出来ず、焼成後電極周辺の基板にお いてクラックが発生してしまう。このため、前述の高精 度の平面方向の収縮が起きないガラス・セラミック多層 基板を使用するためには前記基板に適応した導電性ペー スト組成物が必要となる。

【0010】本発明は、上記課題を解決するため、平面 20 のにできる。 方向に収縮を起こさないガラス・セラミック多層基板に 使用しても、電極周辺の基板にクラックが発生すること が無く、かつ電極が密な膜構造で、基板と電極との密着 を図ることが出来る導電性インキを提供することを目的 とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を目的を達成す る、本発明の導電性インキは、無機成分、溶剤及び有機 パインダを少なくとも含む導電性インキであって、Cu Oが80.0~95.0体積%、Ni、Mo、Zr及び 30 導電性インキの作製に用いられる公知の材料を任意に用 Mnから選ばれる少なくとも1種である金属粒子が1. 0~10.0体積%、無機パインダが4.0~10.0 体積%からなる無機組成物を含み、無機成分を分散させ たことを特徴とする。

【0012】前記構成においては、CuO粒子の平均粒 径が1.0~7.0 μ mであることが好ましい。また前 記構成においては、金属粒子の平均粒径が1.0~6. 0 μmであることが好ましい。

【0013】まt前記構成においては、無機パインダ粒

子の平均粒径が1.0~5.0 μ mであることが好まし 11

[0014]

【作用】前記本発明の導電性インキによれば、無機成 分、溶剤及び有機パインダを少なくとも含む導電性イン キであって、CuOが80.0~95.0体積%、N i、Mo、Zr及びMnから選ばれる少なくとも1種で ある金属粒子が1.0~10.0体積%、無機パインダ が4.0~10.0体積%からなる無機組成物を含み、 無機成分を分散させたことにより、平面方向に収縮を起 こさないガラス・セラミック多層基板に使用しても、電 極周辺の基板にクラックが発生することが無く、かつ電 極が密な膜構造で、基板と電極との密着を図ることが出 来る導電性インキを達成できる。すなわち、焼成時にお けるCuの焼結を遅らせ、Cuの軟化温度よりも高い軟 化温度の金属粒子を添加しているので、ガラス・セラミ ック基板焼結までは電極の焼結を抑えて後に焼結が始ま り、電極がより密な膜構造をとり、かつ電極周辺の基板 のクラックが発生しないものとなり、信頼性も良好なも

【0015】また、CuO粒子の粒径を1.0~7.0 μ mに、金属粒子の平均粒径を1.0~6.0 μ mに、 または無機成分中の無機バインダ粒子の平均粒径を1. $0 \sim 5$. $0 \mu m$ とそれぞれすることにより、電極がより 密な膜構造をとり、かつ電極周辺の基板のクラックが発 生しないので好ましい。

[0016]

【実施例】以下具体例を用いて本発明を説明する。本実 施例の導電性インキの溶剤及び有機バインダは、一般の いることができる。無機成分中の無機パインダには、主 にガラスが用いられる。

【0017】(実施例1)本実施例で用いたペースト は、無機組成としてCuO(平均粒経2.0 µm)、M o (平均粒径4.0μm)、ガラスフリット(日本電気 硝子社製ホウ珪酸鉛ガラス、平均粒経3.0μm)から なるものである。無機粉体組成を(表1)に示す。

[0018]

【表1】

6

5

無機組成(体積%)		接着強度	無機組成(体積%)			接着強度	
Cu0	Мо	ガラス	(kg/2mm∏)	Cu0	Жо	ガラス	(kg/2mm[])
96. 0	0.5	3. 5	0.23	91.5	5. 0	3. 5	1.41
95. 5	0.5	4.0	0. 43	91.0	5. 0	4.0	2.55
93. 5	0.5	6.0	0. 45	89. 0	5.0	6. 0	2. 89
91. 5	0.5	8.0	0.50	87. 0	5. 0	8. 0	2. 80
89. 5	0. 5	10.0	0.56	85. 0	5.0	10.0	2. 76
89.0	0. 5	10.5	0.55	84. 5	5.0	10.5	1. 95
95. 5	1. 0	3.5	1.11	86. 5	10.0	3. 5	1. 45
95.0	1. 0	4.0	2. 21	86.0	10.0	4. 0	2. 80
93.0	1.0	6. 0	2. 49	84.0	10.0	6.0	2.80
91.0	1.0	8. 0	2. 58	82.0	10.0	8. 0	2. 56
89.0	1.0	10.0	2.54	80.0	10.0	10.0	2. 66
88. 5	1.0	10.5	1.86	79.5	10.0	10. 5	1. 76
94.0	2. 5	3. 5	1.02	86.0	10.5	3. 5	1. 66
93.5	2. 5	4.0	2.44	85.5	10.5	4.0	1. 79
91.5	2. 5	6. 0	2.56	83.5	10.5	6. Q	1. 65
89.5	2. 5	8. 0	2.59	81.5	10.5	8. 0	1.60
87.5	2. 5	10.0	2.71	79.5	10.5	10.0	1.74
87.0	2. 5	10.5	1.84	79.0	10.5	10.5	1. 44

【0019】この(表1) に示すそれぞれの組成のミル ベースをセラミック3本ロールにより適度な粘度になる ように、溶剤(関東化学社製αターピネオール、95重 量%)と有機パインダ(日進化成社製エチルセルロー ス、5重量%)とともに混練し、CuOインキを作製し た。

【0020】このCuOインキを使用してスクリーン印 刷機により、低温焼成用ガラス・セラミックのグリーン 30 5.0体積%、Moが1.0~10.0体積%、無機バ シート上に印刷を行った。この印刷したグリーンシート を必要枚数積層し、両面にアルミナグリーンシートを積 層した状態で熱圧着して積層体を形成した。熱圧着条件 は、温度が80℃、圧力は200 Kg/cm²であった。この 積層体を箱型炉において空気中で500℃、2時間保持 し有機パインダ除去を行ない、還元炉において水素10 0%中で400℃、5時間保持し還元を行ない、メッシ ュベルト炉において純窒素中で950℃、1時間の焼成 を行った。この焼成後の導体電極を接着強度での性能評 価を行った。

【0021】(性能評価方法)接着強度:基板上に2m m×2mm導体膜12箇所のパターンの印刷を行ない前 記工程により焼成を行った。その後パターン上にクリー ム半田を付け、ベルト伝熱式リフロー炉においてリフロ 一温度350℃、ベルトスピード0.6m/分で導体膜 上に金メッキしたリン青銅のピンを付けた。このサンプ ルを試験機でピンの垂直方向から力を加え、基板から導 体膜が剥がれるときの接着強度を測定した。その結果も (表1) に示す。

【0022】 (表1) に示されるように、接着強度はM 50

○添加量が1.0~10.0体積%、ガラス添加量が4 ~10体積%の時、接着強度は2kg/2mm□以上あ るが、Mo量が1.0体積未満、ガラス量が4.0体積 %未満では強度が弱く、10体積%より多くなっても大 きな強度の向上はみられない。このことから実際の使用 時に必要な性能として接着強度2.0kg/2mm□以 上となるのは、無機組成においてCuOが80.0~9 インダであるガラスが4.0~10.0体積%から構成 されるときである。そして、СиОが89.0体積%、 Moが5. 0体積%、無機パインダであるガラスが6. 0体積%から構成されるときが最も好ましい結果が得ら れた。

【0023】(実施例2)本実施例で用いたペースト組 成は、無機粉体にはCuO(平均粒径5.5 μm) 8 9. 0体積%、Ni5. 0体積%、ガラスフリット(日 本電気硝子社製ホウ珪酸鉛ガラス、平均粒径 5. 0 μ 40 m) 6. 0 体積%を使用した。使用したNi 粒子の平均 粒径を(表2)に示す。

[0024]

【表2】

7

Ni粒径 (μm)	電極状態	クテック発生
0.5	密	有
0.8	密	有
1. 0	密	無
5.0	密	無
6.0	老	無
7.0	粗	無
9.0	粗	無

【0025】前述の組成のミルベースをセラミック3本ロールにより適度な粘度になるように、溶剤(関東化学社製 αターピネオール、92重量%)と有機パインダ(日進化成社製エチルセルロース、8重量%)とともに混練し、Cu Oインキを作製した。

【0026】このCuOインキを使用してスクリーン印刷機により、低温焼成用ガラス・セラミックのグリーンシート上に印刷を行った。この印刷したグリーンシートを必要枚数積層し、両面にアルミナグリーンシートを積 20層した状態で熱圧着して積層体を形成した。熱圧着条件は、温度が80℃、圧力は200㎏/cm²であった。この積層体を箱型炉において空気中で500℃、2時間保持し有機パインダ除去を行ない、還元炉において水素100%中で400℃、5時間保持し還元を行ない、メッシュベルト炉において純窒素中で950℃、1時間の焼成を行った。この焼成後の試料のSEM観察により、導体電極の状態と電極周辺の基板のクラックの発生の有無を

評価した。その結果も(表2)に示す。

【0027】(表2)に示されるようにNi粒子平均粒径が $1.0\sim6.0\mu$ mであるときに特に好ましい結果が得られた。なお本実施例において、無機組成に使用する金属粒子としてMo、Niを使用したが、2r、Mn、もしくはNi、Mo、2r、Mnを数種添加したときにも同様の効果が得られた。また本実施例ではCuO平均粒径 2.0μ m、 5.5μ m、無機パインダ平均粒径、 3.0μ m、 5.0μ mのものを使用したが、CuOを径 $1.0\sim7.0\mu$ m、無機パインダ粒径 $1.0\sim5.0\mu$ mである時には同様の効果が得られた。

[0028]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明の導電性インキによれば、無機成分、溶剤及び有機パインダを少なくとも含む導電性インキであって、CuOが80.0~95.0体積%、Ni、Mo、Zr及びMnから選ばれる少なくとも1種である金属粒子が1.0~10.0体積%、無機パインダが4.0~10.0体積%からなる無機組成物を含み、無機成分を分散させたことにより、平面方向に収縮を起こさないガラス・セラミック多層基板に適応した配線電極用の導電性インキを提供できる。

【0029】また、無機成分中のCuO粒子の平均粒径が1.0 \sim 7.0 μ mであり、無機成分中の金属粒子の平均粒径が1.0 \sim 6.0 μ mであり、または無機成分中の無機パインダ粒子の平均粒径が1.0 \sim 5.0 μ mであると、電極がより密な膜構造をとり、かつ電極周辺の基板のクラックが発生しない。

フロントページの続き

(72)発明者 板垣 峰広

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72)発明者 中村 嘉文

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内